

別表(赤字が2022年度変更事項)

共通機器課金単価表(2022年度)

設置場所	装置名	共通機器名(申請書リスト名)	摘要	課金単価(税込)	測定予定試料・時間数推計上の目安・備考
実験室03	マイクロダイセクター	ダイセクター	マイクロスケールでの試料切断・回収	なし	備考1
	マイクロドリル_ジオミルシステム	Geomil	マイクロスケールでの試料切削・回収	なし	備考1
	多機能顕微鏡	顕微鏡	組織や構造の観察	なし	備考1
実験室06	マイクロ波試料分解装置	マイクロ波分解	ICP-MS等の試料の前処理	なし	備考1
実験室07	ガンマ線スペクトロメーター	γ線		2円/100秒	1 サンプルの測定時間: 約72時間
	表面電離型質量分析装置(TIMS)	TIMS-W-filament	ストロンチウム等の同位体	1,500円/測定	未知試料数×1.1(標準試料込み)
		TIMS-Re-filament	ネオジミウム等の同位体	2,200円/測定	未知試料数×1.1(標準試料込み)
		TIMSのみ	利用者選定同位体	3,000円/日	標準物質・フィラメントは利用者が用意すること
高分解能マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置(MC-ICP-MS)	MC-ICPMS-only	多元素同位体測定: 試料作成を含まない	3,000円/時間	Sr: 未知試料数×1.2(標準試料込み), 10分/測定	
	MC-ICPMS-set	多元素同位体測定: 試料作成を含む	4,000円/時間	Pb: 未知試料数×2(標準試料込み), 15分/測定	
実験室08	誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)	ICP-MS	無機多元素質量分析	2,500円/時間	未知試料数×1.5(標準試料込み), 10分/測定
	元素分析装置付き安定同位体比質量分析計(EA-IRMS)	CN-IRMS	有機物のC, N同位体	96,000円/サイクル	1サイクルでの測定可能数(標準試料込み)は100~400程度(試料による), 備考2
		CN微量-IRMS	微量な有機物のC, N同位体	85,000円/サイクル	1サイクルでの測定可能数(標準試料込み)は80~250程度(試料による), 備考2
		CN-IRMS(測定数)	有機物のC, N同位体	1,000円/測定	未知試料数+標準試料数(少数の未知試料でも標準試料が20~40は必要), 備考2
	オンラインガス調製/導入システム付き安定同位体比質量分析計(GB-IRMS)	炭酸塩-IRMS	炭酸塩, DICのC, O同位体	200円/測定	未知試料数×1.1(標準試料込み)
	熱分解型元素分析装置付き安定同位体比質量分析計(TC/EA-IRMS)	有機物OH-IRMS	有機物のO, H同位体	350円/測定	未知試料数×1.3(標準試料込み)
		有機物H-Cr-IRMS	有機物のH同位体(N含有有機物など)	400円/測定	未知試料数×1.3(標準試料込み)
	元素分析装置付き安定同位体比質量分析計(EA-IRMS)	S-IRMS	無機・有機物のS同位体	75,000円/サイクル	1サイクルでの測定可能数(標準試料込み)は100~200程度(試料による), 備考2
		S-IRMS(測定数)	無機・有機物のS同位体	1,250円/測定	未知試料数+標準試料数(少数の未知試料でも標準試料が20~30は必要), 備考2
	デュアルインレット分析(Dual Inlet-IRMS)	Dual Inlet-IRMS	ガス態の同位体	なし	標準ガスは利用者が用意すること
水平衡装置付き安定同位体比質量分析計(水平衡OH-IRMS)	水平衡OH-IRMS	水のH, O同位体	要相談	分析数に依存するため、あらかじめ相談すること	
ガスクロマトグラフ燃焼装置付き安定同位体比質量分析計(GC/C-IRMS)	GC/C-IRMS	化合物レベル同位体	要相談	分析試料・手法により変動するため、あらかじめ相談すること	
実験室10	誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES)	ICP発光	無機多元素同時定量	1,500円/時間	未知試料数×1.3(標準試料込み), 5分/測定
	誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS/MS)	ICP-QQQ	無機多元素質量分析	2,500円/時間	未知試料数×1.5(標準試料込み), 10分/測定
	水同位体比分析装置(CRDS)	Picarro	水のH, O同位体	400円/測定	未知試料数×1.5(標準試料込み)
	イオンクロマトグラフ(IC)	イオンクロ	溶液中の無機イオン濃度	400円/測定	未知試料数×1.3(標準試料込み)
実験室11	低温灰化装置	低温灰化	揮発性無機元素の損失を抑えた灰化処理	なし	備考1
実験室17	試料粉碎装置ミキサーミル	ミキサーミル	少量の試料の粉碎	なし	備考1
	試料切断研磨装置	Discoplan	岩石等の固体試料の切断および研磨	なし	備考1

備考1: 試料前処理に用いるものであるため、単独での課金は発生しない。

備考2: CN-IRMS, CN微量-IRMSおよびS-IRMSに関しては、装置の立ち上げ回数(サイクル)に応じた課金を基本とするが、分析数(標準試料込み)が少ないものについては測定数に応じて課金する測定数設定も選択可能とする(ただし、分析希望試料が分析管の劣化を早めるもの(例: 堆積物、フィルター等)を除く)。詳細は、毎回の装置利用申請後、計測・分析部門と相談の上決定する。